

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

**Sardsüsteemid**  
(Embedded Systems)

13. Loeng  
Töökindlus

www.pld.ttu.ee/IAF0042

**Gert Jervan**  
Arvutitehnika instituut  
www.pld.ttu.ee/~gerje



Some materials: © Petru Eles

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

**Sardsüsteemid ja usaldusväarsus**

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II – Sardsüsteemid – Loeng 13

**Nõudmised usaldusväarsusele**

- ✓ **Sardsüsteemid peavad olema usaldusväärsed (dependable)**
- ✓ On süsteeme, kus lubatakse vaid 1 rike  $10^9$  töötunni kohta, see tähendab 1 rike 114 000 aasta kohta
  - ~ 1000 korda väiksem tüüpilisest kiipide rikete arvust.
  - Ohutuskriitilistes süsteemides peavad süsteemid olema töökindlamad, kui selle komponendid individuaalselt.
  - Tuleb kasutada veakindlust suurendavaid mehhanisme.
- ✓ Madal lubatud rikete arv → süsteemid ei saa olla 100% testitavad.
  - Ohutus on kombinatsioon testimisest ja analüüsist. Lisaks peab arvestama nii disaini käigus tehtud vigadega kui ka inimeste poolt põhjustatud riketega.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

3

© Gert Jervan Arvutid II – Sardsüsteemid – Loeng 13

**Veakindlus**

- ✓ Veakindlaks nimetatakse süsteeme, mis jätkavad oma ettenähtud ülesannete täitmist isegi siis, kui esinevad rikked:
  - riistvaras
  - tarkvaras
  - kasutaja eksimused
  - keskkond, sisendandmed, ...
- ✓ Veakindlus on eeldus, mis võimaldab süsteemil saavutada veakindla opereerimise

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4

© Gert Jervan Arvutid II – Sardsüsteemid – Loeng 13

**Põhikontseptsioon**

- **Veakindlus (fault tolerance)** on väga tihedalt seotud usaldusväarsusega (dependable).
  - **Töökindlus (Reliability)  $R(t)$**  = tõenäosus, et süsteem töötab korralikult kui ta töötab ajahetkel  $t=0$
  - **Remonditavus (Maintainability)  $M(d)$**  = tõenäosus, et süsteem töötab taas korralikult  $d$  ajaühikut peale vea esinemist.
  - **Töövalmidus (Availability)  $A(t)$** : Tõenäosus, et süsteem töötab ajahetkel  $t$
  - **Ohutus (Safety)**: Süsteem ei põhjusta kahju.
  - **Turvalisus (Security)**: Konfidentsiaalne ja usaldatav kommunikatsioon

Isegi ideaalselt loodud süsteemid võivad läbi kukkuda, kui eeldused süsteemi töökoormuse võimalike vigade kohta on valed. Süsteeme ei saa teha usaldusväärseks tagantjärele, vaid sellega tuleb arvestada süsteemi loomise algusest alates.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

5

© Gert Jervan Arvutid II – Sardsüsteemid – Loeng 13

**Põhiterminoloogia**

- ✓ **Viga (fault)**: süsteemis esinev defekt või situatsioon, mis võib viia süsteemi töö tõrkeni
- ✓ **Rike (error)**: vea avaldumine – vale käitumine
- ✓ **Tõrge (failure)**: süsteem ei täida oma ettenähtud funktsiooni

Viga → Rike → Tõrge

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

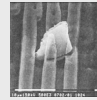
6

## Vigade näited

- ✓ Bit-flipid seoses kosmilise kiirgusega:
  - A person on an airplane over the Atlantic at 35,000 ft working on a laptop with 256 Mbytes (2 Gbits) of memory. At this altitude, the soft error rate (SER) of 600 FITs per megabit becomes 100,000 FITs per megabit, resulting in a potential error every five hours.
  - 1 FIT (failures in time), is the number of failures in 1 billion device-operation hours. A measurement of 1000 FITs corresponds to a MTTF (mean time to failure) of approximately 114 years.

## Vigade klassifikatsioon

- ✓ Püsivad: viga on stabiilne ja alaline
  - Vigane komponent tuleb asendada
  - Klassikaline näide: *stuck-at* vead
- ✓ Perioodilised rikked (intermittent)
  - Esinevad ajutiselt, seoses süsteemi või selle komponentide ebastabiilsusega (näiteks ebakindel ühendus)
- ✓ Ajutised rikked (transient)
  - Viga, mis lähtub ajutistest keskkonnamõjudest
  - Näiteks pingelang või EMI



Äikesetormid

## Tõrgete klassifikatsioon

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Domain/Nature           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Value failure</li> <li>■ Timing failure</li> </ul> </li> <li>✓ Perception           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consistent failure</li> <li>■ Inconsistent failure</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Effect           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Benign failure</li> <li>■ Malign/catastrophic failure</li> </ul> </li> <li>✓ Frequency           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Single failure</li> <li>■ Repeated failure</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

## Tõrked (Failures)

- ✓ **Crash** Failure: After an error has been detected, the component stops silently.
- ✓ **Omission** Failure: Sometimes a result is missing; when result is available, it is correct.
- ✓ **Consistent** Failure: If there are multiple receivers, all see the same erroneous result.
- ✓ **Byzantine** (Malicious, Asymmetric) Failure: Different receivers see differing results.

## Tõrked (2)

- ✓ **Timing** Failure: A server's response lies outside the specified time interval.
- ✓ **Response** Failure: The server's response is incorrect (value of the response is wrong, server deviates from the correct flow of control).
- ✓ **Arbitrary** Failure: A server may produce arbitrary responses at arbitrary times.

## Vigadega toime tulemine

- ✓ Vigade elimineerimine: eemalda probleemide algusalikad
  - Kõrvalda defektid: test & debug
  - Robustne disain: vähendab defektide tõenäosust
  - Vähenda keskkonnamõjusid: kaitsmed

### Võimatu on vältida kõiki vigu

- ✓ Veakindlus: liiasuse lisamine, et vigu maskeerida
  - Vaja on täiendavaid ressursse
  - Näited:
    - Error correcting codes (Hamming, Red Solomon), hääletamine, maskeerimine, kontrollsummad...
    - Backup, replication, ...

## Veakindluse saavutamine

- ✓ **Vigade avastamine** on protsess, et tuvastada vigade esinemist. Veakindluse saavutamise esmaseid tegevusi. Näiteks error detection codes, isekontrollivad loogikaskeemid, timerid, jne...
- ✓ **Vigade lokaliseerimine** on protsess, et tuvastada, kus viga on toimunud, et alustada vastava taastamisprotseduuriga

## Veakindluse saavutamine

- ✓ **Vigade piiritlemine** on protsess, et viga isoleerida ja vältida selle mõju süsteemi ülejäänud osadele (vältida levimist)
- ✓ **Veast taastumine** on protsess, mille käigus süsteem püüab jääda tööle või taastada oma töövõime läbi rekonfiguratsiooni (isegi, kui rike on süsteemis alles). Näited: vigade maskeerimine, kordamine, tagasipöördumine jne...

## Definitsioonid

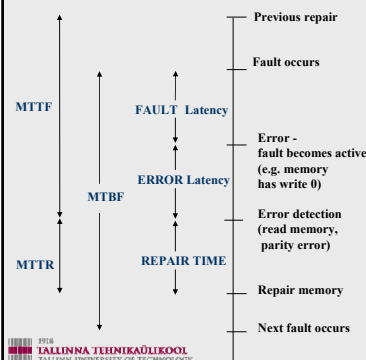
- ✓ Tõrgete sagedus ( $\lambda$ ):
  - Keskmise sagedus, millega tõrked tekivad.

$$\frac{6 \text{ failures}}{7502 \text{ hrs}} = 0.0007998 \text{ failures / hr} = 799.8 \times 10^{-6} \text{ failures / hr}$$

- ✓ Mean time to failure (MTTF):
  - Average time between failures

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

## Usaldusväärsus



**Reliability (Tõkkindlus):**  
a measure of the continuous delivery of service;  
 $R(t)$  is the probability that the system survives (does not fail) throughout  $[0, t]$ ;  
expected value:  $MTTF$  (Mean Time To Failure)

**Maintainability (Remonditavus):**  
a measure of the service interruption  
 $M(t)$  is the probability that the system will be repaired within a time less than  $t$ ;  
expected value:  $MTTR$  (Mean Time To Repair)

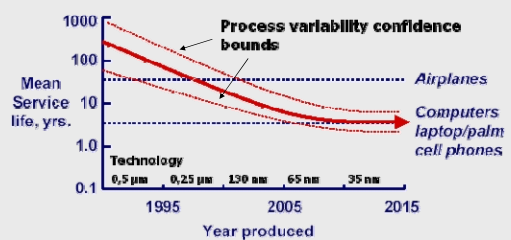
**Availability (Tõõvalmidus):**  
a measure of the service delivery with respect to the alternation of the delivery and interruptions  
 $A(t)$  is the probability that the system delivers a proper (conforming to specification) service at a given time  $t$ ;  
expected value:  $EA = MTTF / (MTTF + MTTR)$

**Safety (Ohutus):**  
a measure of the time to catastrophic failure  
 $S(t)$  is the probability that no catastrophic failures occur during  $[0, t]$ ;  
expected value:  $MTTCF$  (Mean Time To Catastrophic Failure)

## Tehnilised trendid

	1990	2000	2010
Operating temperature, °C	-55 to 125	-40 to +85	0 to 70
Supply voltage	5v	1.5v	0.6v
Max. power (high perf.)	5	100	170
No. of package types	<10	<80	??
Design support life	>10 yrs.	1-5 yrs.	<1yr.
Production life	>10 yrs.	3-5 yrs.	<3yrs.
<b>Service life</b>	<b>&gt;20 yrs.</b>	<b>5-10 yrs.</b>	<b>&lt;5yrs.</b>

## Kiipide töökindluse hindamine



\*Extrapolated from ITRS roadmap, MRQW-2002, Bernstein

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Töövalmidus

$$Availability = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

- ✓ Töövalmidus:
  - Probability that system is operational at time  $t$
- ✓ Kõrge töövalmidus:
  - $MTTF \rightarrow \infty$  (high reliability)
  - $MTTR \rightarrow 0$  (fast recovery)

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 19

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Remonditavus

- ✓  $M(t)$  on tõenäosus, et vigane süsteem on võimalik uuesti töökorda viia ajaperioodi  $t$  jooksul.
- ✓ Taastamise protsess:
  - Vea lokaliseerimine, näiteks läbi diagnostika
  - Süsteemi parandamine
  - Süsteemi töövalmidusse toomine

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 20

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Graceful Degradation

- ✓ The ability of system to automatically decrease its level of performance to compensate for hardware failure and software errors.

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 21

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Töövalmiduse üheksate muut

Üheksat	Töövalmidus	Rikkeaeg aastas	Rikkeaeg nädalas	Näide
2 üheksat	99%	3.65 päeva	1.7 tundi	Tavaline veebikülg
3 üheksat	99.9%	8.75 tundi	10.1 min	E-kaubandus
4 üheksat	99.99%	52.5 min	1.0 min	Suur mailserver
5 üheksat	99.999%	5.25 min	6.0 s	Telefonisüsteem
6 üheksat	99.9999%	31.5 s	0.6 s	Carrier-grade andmeside

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 22

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Ajalooline areng

- ✓ Mean Time Between Failures:
 
$$MTBF = MTTR + MTTF$$
  - ENIAC. MTBF: 7 minutit (18000 elektronlampi)
  - F-8 Crusader – esimene fly-by-wire
    - MD-11
    - A320 family
  - Patriot raketikaitse süsteem
    - Vajas rebooti iga 8 tunni järel. Sellest saadi teada väga valusalt moel esimese lahesõja ajal...

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 23

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Ultra-töökindlad süsteemid

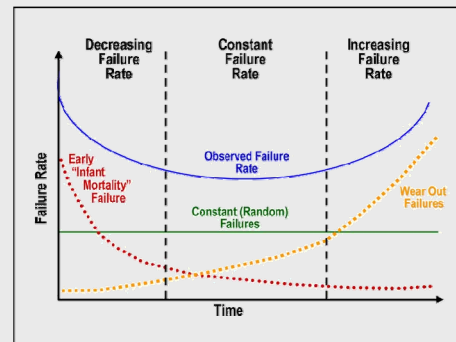
- ✓ Airbus A320 perekonna fly-by-wire süsteem:
  - Kõik täiturid on arvutite poolt kontrollitavad
  - Ei mingeid juhttrosse ega kaableid
  - 5 kesket lennuarvutit
  - Kasutatakse erinevaid riistvaralisi lahendusi
    - Thomson CSF => 68010
    - SFENA => 80186
  - Tarkvara mõlemale platvormile on kirjutatud erinevate tarkvaraloojate poolt (sõltumatult)
  - Kogu rikete avastamine & debug teostati eraldi
  - Arvuti lubab piloodil lennata mingite ettenähtud parameetrite piires (flight envelope)
    - väljaspool seda võtab arvuti juhtimise üle

1978 TALLINNA TEHNIAÜLICOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 24

## Riistvara ja keskkonna tõrked

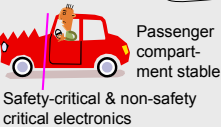
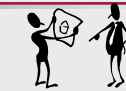
- ✓ Liikuvad osad, suur kiirus, madal tolerants, suur keerukus: kettad, tape drives/libraries
- ✓ Madalaim MTBF on ventilaatoritel ja toiteallikatel
- ✓ Tihti ventilaatorid "väsisvad" → väikesed juhuslikud rikked CPUs, mälus, backplane'is
- ✓ Keskkond: Vool, jahutus, niiskus, kaablid, tuli, kokku kukkuvad rackid, ventilatsioon, tormid, ...

## Vanni kõver



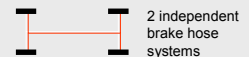
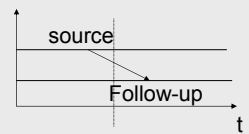
## Kopetz'i 12 disainipõhimõtet (1-3)

1. Safety considerations may have to be used as the important part of the specification, driving the entire design process.
2. Precise specifications of design hypotheses must be made right at the beginning. These include expected failures and their probability.
3. Fault containment regions (FCRs) must be considered. Faults in one FCR should not affect other FCRs.



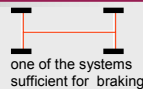
## Kopetz'i 12 disainipõhimõtet (4-6)

4. A consistent notion of time and state must be established. Otherwise, it will be impossible to differentiate between original and follow-up errors.
5. Well-defined interfaces have to hide the internals of components.
6. It must be ensured that components fail independently.



## Kopetz'i 12 disainipõhimõtet (7-9)

7. Components should consider themselves to be correct unless two or more other components pretend the contrary to be true (principle of self-confidence).
8. Fault tolerance mechanisms must be designed such that they do not create any additional difficulty in explaining the behavior of the system. Fault tolerance mechanisms should be decoupled from the regular function.
9. The system must be designed for diagnosis. For example, it has to be possible to identifying existing (but masked) errors.



## Kopetz'i 12 disainipõhimõtet (10)

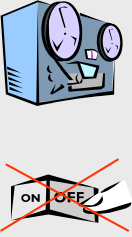
10. The man-machine interface must be intuitive and forgiving. Safety should be maintained despite mistakes made by humans



© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Kopetz'i 12 disainipõhimõtet (11-12)

- Every anomaly should be recorded. These anomalies may be unobservable at the regular interface level. Recording to involve internal effects, otherwise they may be masked by fault-tolerance mechanisms.
- Provide a never-give up strategy. ES may have to provide uninterrupted service. Going offline is unacceptable.



1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

31

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Valideerimine

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Valideerimine

- ✓ Valideerimine on kontroll, et loodud süsteem vastab talle pandud piirangutele, töötab nagu eeldatud – kas me lõime õige asja.
- ✓ Kasutatakse palju simuleerimist, emuleerimist, ...

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

33

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Kiipsüsteemide funktsionaalne valideerimine

Year	Logic Gates	Simulation Vectors	Engineer Years
1995	1M	100M	20
2001	10M	10B	200
2007	100M	1000B	2000

Source: Synopsys

71% of SOC re-spins are due to logic bugs

Source: G. Spirakis, keynote address at DATE 2004

34

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Mikroprotsessorite funktsionaalne valideerimine

- ✓ Functional validation is a major bottleneck
  - Deeply pipelined complex microarchitectures

Generation	Pre-silicon logic bugs per generation
Pentium	800
Pentium Pro	2240
Pentium 4	7855
Next ?	25000

(Source: Tom Schubert, Intel, DAC 2003)

- ✓ Logic bugs increase at 3-4 times/generation
  - Bugs increase (exponential) is linear with design complexity growth.

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

35

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Näide termosimuleerimisest

- ✓ Encapsulated cryptographic coprocessor:

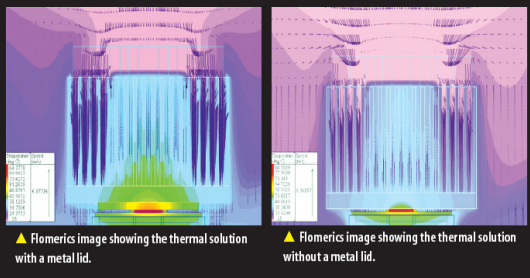
Source: [http://www.coolingzone.com/Guest/News/NL\\_JUN\\_2001/Camp1/Jun\\_Camp1\\_2001.html](http://www.coolingzone.com/Guest/News/NL_JUN_2001/Camp1/Jun_Camp1_2001.html)

36

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Näide termosimuleerimisest (2)

Mikroprotsessor



▲ Flomerics image showing the thermal solution with a metal lid.

▲ Flomerics image showing the thermal solution without a metal lid.


Source: [http://www.floterm.com/applications/app141/mot\\_chip.pdf](http://www.floterm.com/applications/app141/mot_chip.pdf)

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 37

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## EMC simuleerimine

Näide: auto mootorikontroller (ECU)



Red: high emission  
Validation of EMC properties often done at the end of the design phase.


Source: [http://intrade.insa-tlse.fr/~etienne/emccourse/what\\_for.html](http://intrade.insa-tlse.fr/~etienne/emccourse/what_for.html)

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 38

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Simuleerimise piirangud

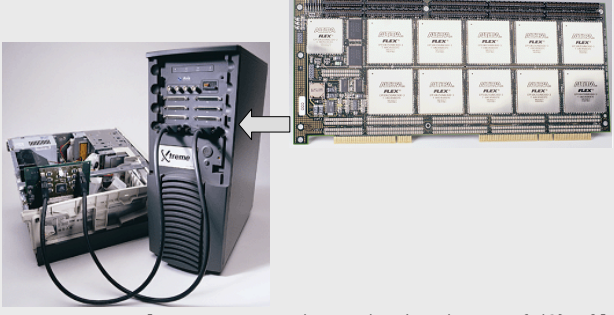
- ✓ Tüüpiliselt aeglasem kui valmis disain.
- ✓ **Ajaliste piirangute mittetäitmine** on seetõttu reaalses keskkonnas väga tõenäoline
- ✓ Simuleerimine reaalses keskkonnas võib olla **ohtlik**
- ✓ Simuleeritavate andmete hulk võib olla tohutu
- ✓ Enamus reaalseid süsteeme on liiga keerukad, et simuleerida kõike (sisendeid) **Simulatsioonid aitavad vigu leida, kuid need ei garanteeri vigade mitteesinemist**



1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 39

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Emuleerimine



✓ [[www.verity.com/images/products/xtremep{1|3}.gif](http://www.verity.com/images/products/xtremep{1|3}.gif)]

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 40

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

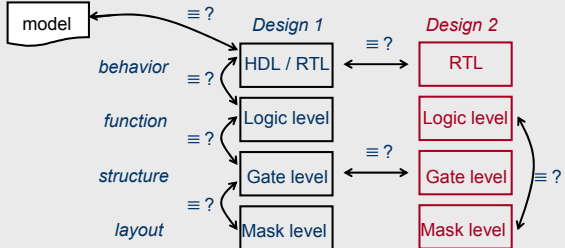
Arvutitehnika instituut ati.ttu.ee

## Verifitseerimine

Tallinna Tehnikaülikool Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Verifitseerimine



1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 42

## Verifitseerimine

- ✓ Põhiline eesmärk on kontrollida, kas meie tehtud disainisammu tulemus on õige. Kas me disainisime süsteemi õieti.
  - Spec→süsteemitase, kõrgtase→RTL, jne...
  - Simuleerimine, emuleerimine, ...
- ✓ Formaalne verifitseerimine
  - Formaalne kontroll, kasutades formaalseid mudeleid, matemaatikat (loogikat)
    - Model checking, equivalence checking

## Ekstreemne näide

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

- ✓ How do you verify a design which has bugs like this??
- ✓ The FMUL instruction, when the rounding mode is set to "round up", incorrectly sets the sticky bit when the source operands are:
 
$$\text{src1}[67:0] = X*2^i + 15 + 1*2^i$$

$$\text{src2}[67:0] = Y*2^j + 15 + 1*2^j$$
 where  $i+j = 54$  and  $\{X,Y\}$  are integers

## And the answer is...

- ✓ Hire 70+ validation engineers
- ✓ Buy several thousand compute servers
- ✓ Write 12,000 validation tests
- ✓ Run up to 1 billion simulation cycles per day for 200 days
- ✓ Check 2,750,000 manually-defined properties
- ✓ Find, diagnose, track, and resolve 7,855 bugs
- ✓ Apply formal verification with 10,000 proofs to the instruction decoder and FP units
  - This found that obscure FMUL bug!

## Testimine

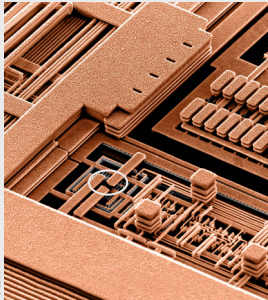
Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

## Testimine

- ✓ Testimine tootmisvigade vastu:
  - Tootmisliini lõpus
  - Peale tarnimist
- ✓ O&M test
  - Peale tarnimist
- ✓ Test: testide genereerimine, testide rakendamine, väljundite jälgimine, väljundi hindamine

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Defektid



- ✓ Device level
  - shorts, cracks, leaks, impurities, bonding, ...
- ✓ Board level
  - component errors, track errors, ...
- ✓ Functional
  - Incorrect design
- ✓ Wearout/Environment
  - temperature, humidity, vibration, radiation...

**Fault model -**  
abstraction mechanism for describing defects mathematically

TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

49

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Näide tootmisdefektist



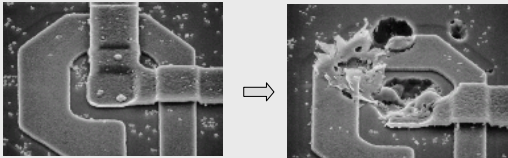
TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

50

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Näide vananemisest

Metal migration @ Pentium 4



www.jwhipple.com/computer\_hangs.html

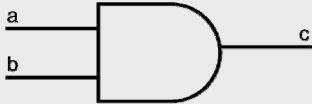
TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

51

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Veamudelid

- ✓ Stuck-at fault model



Possible Errors: 6  
 "a" s-a-1, "a" s-a-0  
 "b" s-a-1, "b" s-a-0  
 "c" s-a-1, "c" s-a-0

TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

52

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Testide genereerimine

- ✓ Totaalne testimine
  - 2<sup>n</sup> test vektorit n sisendiga kombinatoorse skeemi jaoks

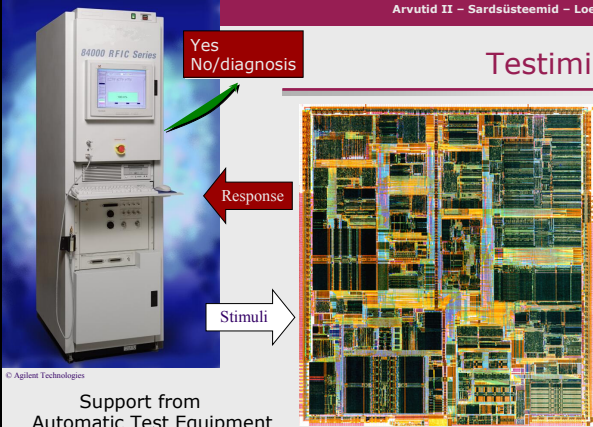
n	2	10	20	100
2 <sup>n</sup>	4	~10 <sup>3</sup>	~10 <sup>6</sup>	~10 <sup>30</sup>
- ✓ Pseudojuhuslikud testid
- ✓ Deterministlikud testid
  - Deterministlike testide genereerimine on NP-keerukas probleem!!
  - Erinevad heuristikad

TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

53

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Testimine



Support from Automatic Test Equipment

TALINNA TEHNIAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

54

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Väline Testimine

- ✓ Probleemid
  - ATE-d on väga kallid (tüüpiliselt mitu miljonit USDd)
  - ATE-d muutuvad üha ebaefektiivsemateks
  - Aeglane testide rakendamine
  - Andmemahud võivad olla väga suured (sõltuvalt kiibi keerukusest)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

55

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Built-in Self-Test (BIST)

- ✓ Lahendus: spetsiaalne sisseehitatud riistvara testide genereerimiseks ja rakendamiseks
- ✓ Testri tükeldamine
- ✓ Odav aga suure kiirusega sisemine tester

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

56

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Kokkuvõte

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Töökindlus nõuab süstemaatilist lähenemist

<b>Applications</b>	Application program interface (API) Middleware	Checkpointing and rollback, application replication, software, voting (fault masking), process pairs, robust data structures, recovery blocks, N-version programming,
<b>Reliable communication</b>		CRC on messages, acknowledgment, watchdogs, heartbeats, consistency protocols
<b>Operating system</b>		Memory management and exception handling, detection of process failures, checkpoint and rollback
<b>Hardware</b>	System network Processing elements Memory Storage system	Error correcting codes, M-out-of-N and standby redundancy, voting, watchdog timers, reliable storage (RAID, mirrored disks)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

[ lyer ] 58

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Veakindlus

- ✓ Veakindlus ja usaldusväarsus on süsteemsed teemad, nõudes töötamist nii **riistvara**, **tarkvara**, **aja** kui ka **informatsiooni** probleemidega
- ✓ Üha keerukam on töötada riistvara probleemidega

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

59

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Sellest kõigest räägitakse palju pikemalt magistriõppes...

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

## ATI ained sardsüsteemide valdkonnas

- ✓ IAF0610 Testimise projekteerimine (R. Ubar)
- ✓ IAY0021/22 Mikroprotsessorsüsteemid I/II (A. Toomsalu)
- ✓ IAY0040 Riistvara kirjelduskeeled ja modelleerimine (P. Ellervee)
- ✓ IBX0020 Robotika (M. Kruusmaa)
- ✓ IAF0530 Süsteemide usaldusväärsus ja veakindlus (G. Jervan)
- ✓ IAF0620 Digitaalsüsteemide verifitseerimine (J. Raik)
- ✓ IAY0180 Sardmikrokontrolleerite riistvara ja tarkvara (A. Toomsalu)
- ✓ IAF0520 Programmeeritavad loogikaskeemid (T. Evtarson)
- ✓ IAY0550 Kiipsüsteemide disain (P. Ellervee)
- ✓ IAY0570 Riist- ja tarkvara koosdisain (K. Tammemäe)
- ✓ IAY0600 Digitaalsüsteemide disain (P. Ellervee)

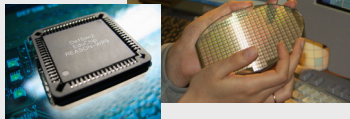
## Arvutitehnika instituut - ATI

www.ati.ttu.ee

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

## Millega me tegeleme?

- ✓ Riistvara ja tarkvara
  - Kiipsüsteemid ja kiipvõrgud
  - Riist- ja tarkvara koosdisain
  - Süsteemide veakindlus, diagnostika ja test
  - Veebirakendused
  - Tarkvaraprotsesside kvaliteet



## Riistvara süntees

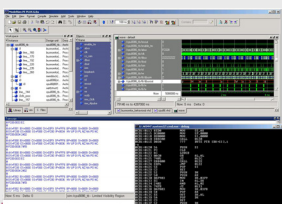
- ✓ Meie kasutada on FPGA arenduskeskkonnad maailma juhtivatelt firmadelt Xilinx, Altera, XESS, ...



## Kiipsüsteemid ja kiipvõrgud

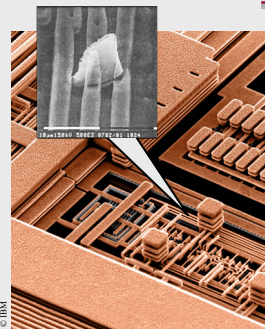
- ✓ Meie tegevused:
  - Modelleerimine
  - Loomine
  - Analüüs
  - Optimeerimine
- ✓ Meie kasutada on CAD tarkvara maailma juhtivatelt tootjatelt:
  - Synopsys, Mentor Graphics, Cadence, etc.

Inteli 8x10 kiipvõrk



## Testimine

- ✓ Tootmisvead
  - Mustus (tolmuosakesed)
  - Halb paigutus
  - Halvad materjalid
  - ...
- ✓ Elu käigus tekkivad vead
  - Vananemine
  - Osakesed
  - ...



Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

Jah, Ei → diagnoos

## Testimine

Vastus

Stimul.

Seadmed firmadelt Göpel ja Saab

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

67

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## Arvutisüsteemid optimeerimine

- ✓ Kiiremaks
- ✓ Paremaks
- ✓ Võimsamaks
- ✓ Energiasäästlikumaks
- ✓ Massiivsed arvutused, terabaitides mälu

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

68

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Centre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering - CEBE

Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus - CEBE

cebe.ttu.ee

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

## CEBE

- ✓ Kolme TTÜ teadusgrupi ja teadussuuna koostöö:
  - Arvutitehnika instituut (ATI) ja töökindlate sardsüsteemide disain
  - Elektroonika instituut (ELIN) ja missioonikriitiliste sardsüsteemide komponendid ning alamsüsteemid
  - Tehnomeedikum (TM) ja biosignaalide interpreteerimine meditsiinitehnikas
- ✓ Kokku on meid ca 80 (nii teadustöötajaid kui ka doktorante)
- ✓ Põhineb kolmel uuel laboril:
  - MINAKO - Mikro- ja Nanotehnoloogiliste Komponentide labor
  - SIE - Siduselektronika labor
  - ASSA - Arvutisüsteemide Sünteesi ja Analüüsi labor

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

70

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

HUMAN BEING

BIOSIGNALS  
biosignal interpretation methods

APPLICATIONS

BIOENGINEERING APPLICATIONS  
health monitoring systems, body area sensor networks, implantable cardiac pacemakers, lab-on-chips

INDUSTRIAL APPLICATIONS  
food processing, medical instrumentation, energy conversion, alternative energy

MISSION CRITICAL EMBEDDED SYSTEMS AND SENSORICS

DATA ACQUISITION  
bioimpedance, biosignals, brain electrical oscillations, biooptical methods

SIGNAL PROCESSING  
theory, methods and algorithms

SYSTEM DESIGN  
synthesis, simulation, verification, emulation

HARDWARE  
beyond silicon, nano-electronics, architectures, ASP, FPGA, ASIC, SoC, NoC

TEST RESEARCH  
test synthesis and analysis, debug and fault diagnosis, dependability

TECHNOLOGY

RELIABILITY

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

71

© Gert Jervan Arvutid II - Sardüsteemid - Loeng 13

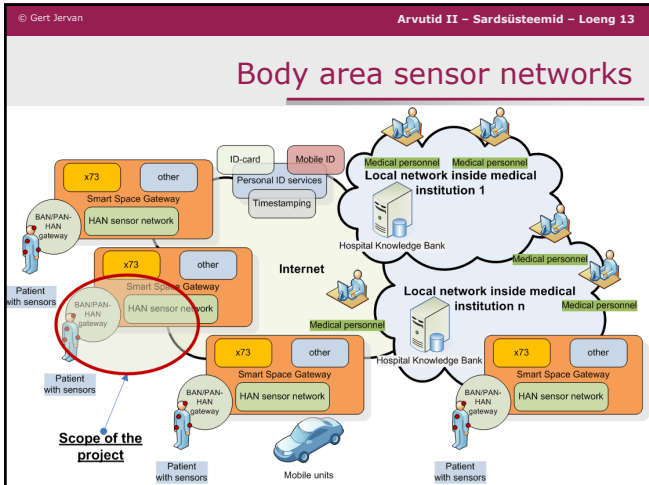
## Personal and body area electronics

### We make electronics disappear by embedding it

into your clothes and bed, under the skin, into your body and organs - lungs, heart, brain, etc... and helping so your healing and making your life more enjoyable when your body organs are injured or weary of life

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

72



© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Magistritöö CEBEs

- ✓ Tippkeskus CEBE otsib oma meeskonda töötahtelisi ja avatud silmaringiga noori inimesi
- ✓ Sinu kasutada oleks ligipääs uusimatele riist- ja tarkvara arendusplatvormidele ning Sul on võimalus teha osa oma magistritööst Euroopa juhtivates teadusülikoolides
- ✓ Töötamine CEBEs annab hea võimaluse astuda kas TTÜ või mõne teise ülikooli doktorantuuri
- ✓ Küsi lisa: Gert Jervan, IT-229, gert.jervan@ati.ttu.ee

74

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Eksam

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut

© Gert Jervan Arvutid II – Sardüsteemid – Loeng 13

## Eksam

- ✓ Kogu info kodulehel: [www.pld.ttu.ee/IAF0042](http://www.pld.ttu.ee/IAF0042)
- ✓ 2 võimalust:
  - 07/01/2009, 10:00-12:00, IT-140
  - 19/01/2009, 10:00-12:00, IT-140
- ✓ Registreerumine Sessikeskuses: [www.pld.ttu.ee/sk](http://www.pld.ttu.ee/sk)
- ✓ Max 30 tudengit – kes ees, see mees!
- ✓ 2 tundi, kolm küsimust, 10 erinevat varianti

76

1918 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO  
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Arvutitehnika instituut  
ati.ttu.ee

## Küsimusi?

**Gert Jervan**  
[www.pld.ttu.ee/~gerje](http://www.pld.ttu.ee/~gerje)

Tallinna Tehnikaülikool  
Arvutitehnika instituut